

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 21

12 ноября 1988 г.

ВЛИЯНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ АНИЗОТРОПИИ
ЗВУКОПРОВОДОВ НА РАЗРЕШЕНИЕ
АКУСТООПТИЧЕСКИХ СПЕКТРОАНАЛИЗАТОРОВ

В.В. Проклов, Р.Г. Савчук

При создании акустооптических (АО) спектроанализаторов целесообразно использовать дифракцию света на медленной сдвиговой акустической волне в оптически одноосных кристаллах типа TeO_2 . Такая геометрия АО взаимодействия обеспечивает хорошее спектральное разрешение и высокую эффективность дифракции. При этом, однако, распространение звуковой волны происходит в условиях сильной акустической анизотропии, которая, как известно, может существенно сказываться на распространении звука и АО взаимодействии в случае акустических пучков конечной апертуры, например, в виде повышенной расходимости потока энергии звука в плоскости ортогональной дифракционной [1], особенностей отражения звука от боковых граней звукопровода [2], уклонения вектора потока энергии от волновой нормали [3] и т.п. В настоящей работе рассматривается новый эффект из этой области – зависимость спектрального разрешения АО спектроанализаторов от акустической анизотропии звукопроводов.

Для пояснения возможности существования такого эффекта рассмотрим диаграмму АО взаимодействия для медленной звуковой волны, показанную на рис. 1. Волновые векторы k_0 и k_1 , соответствуют падающему и дифрагированному свету соответственно, K_0 – медленной акустической волне, распространяющейся вдоль кристаллографического направления [110]. При дифракционной расходимости акустической волны на угол φ_0 , очевидно, в плоскости ортогональной дифракционной возможна дифракция падающего света на акустических волнах с волновыми векторами K_i , отклоненными от

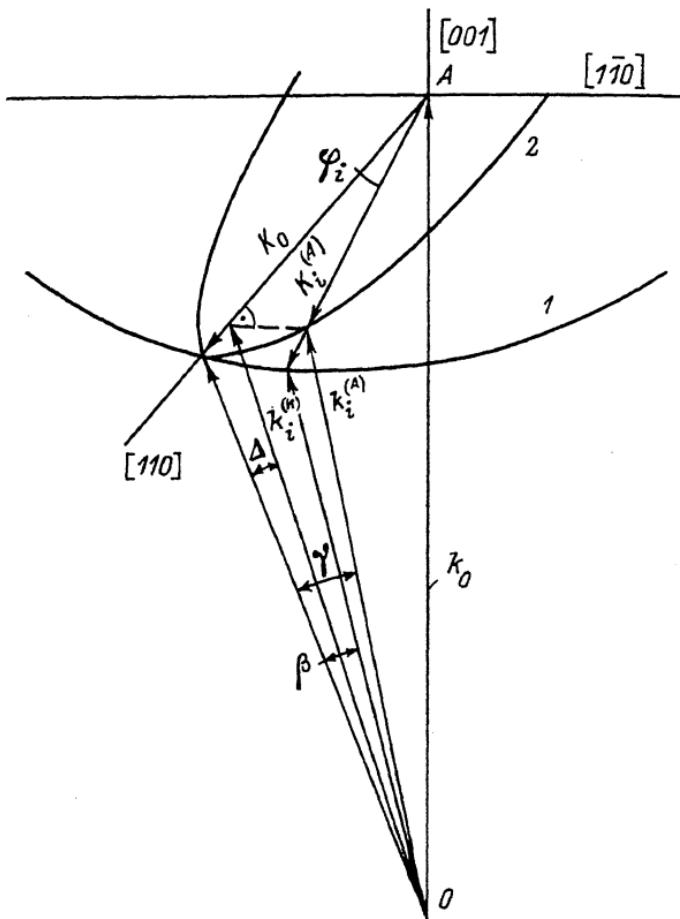


Рис. 1. Диаграмма волновых векторов акусто-оптического взаимодействия.

направления $[110]$ на углы φ_i ($|\varphi_i| \leq \frac{1}{2} \varphi_0$). В случае акустически изотропного кристалла дифрагированный свет с волновым вектором $k_i^{(n)}$ опирался бы на окружность 1 радиуса $|K_0|$, т.е. был бы отклонен от направления k_1 в плоскости ортогональной дифракционной на угол β . При учете анизотропии кристалла волновой вектор $K_i^{(A)}$ звука, распространяющегося под углом φ_i к оси $[110]$, будет опираться на кривую 2, которая является результатом пересечения плоскости, проведенной через точку А ортогонально падающему свету, с поверхностью обратных скоростей звука в кристалле, построенной с центром в точке А, которая для кристаллов симметрии 422 (к ним, в частности, относится и Td_2) представляется эллипсом. При этом угол γ между волновыми векторами k_1 и $k_i^{(A)}$ будет сравним по величине с β , а величина дифрак-

ционного отклонения света в плоскости, ортогональной [110], как видно из рис. 1, не превышает дифракционной расходимости света в той же плоскости $\Delta\theta_1 \approx \frac{\lambda}{H}$, где λ - длина волны света, H - высоты оптического и акустического пучков. В то же время видно, что проекция $k_i^{(1)}$ на направление [110] в анизотропном случае существенно увеличивает „угловую размазку“ дифрагированного света $\Delta\theta_{||}$ в плоскости дифракции, в которой в целях повышения спектрального разрешения сама расходимость падающего света обычно делается малой по сравнению с расходимостью в плоскости ортогональной дифракционной (т.е. $\Delta\theta_{||} \approx \frac{\lambda}{L} \ll \Delta\theta_1 \approx \frac{\lambda}{H}$, так как $L \gg H$, где L - ширина светового луча в дифракционной плоскости).

Простой расчет для анизотропного случая, характеризуемого эллипсом 2 (см. рис. 1) с отношением главных полуосей, равным α , дает для дифракционной „анизотропной угловой размазки“ света в плоскости дифракции (в направлении [110]) для малых значений углов φ_i следующее выражение:

$$\Delta \approx \frac{\alpha^2}{2} \varphi_i^2 \frac{\lambda}{L} \leq \frac{\alpha^2}{8} \cdot \frac{\lambda}{L} \cdot \varphi_o^2, \quad (1)$$

где λ - длина волны звука.

Из (1) видно, что с увеличением акустической анизотропии, т.е. с ростом α , эффект анизотропной размазки оптического дифракционного пятна возрастает и при определенных условиях это может привести к уширению углового спектра дифрагированного света в области низких пространственных частот по сравнению с изотропным пределом углового разрешения, определяемого расходимостью падающего света. Действительно, отношение анизотропной и обычной (изотропной) дифракционных расходимостей света, определенных по критерию Рэлея, для случая прямоугольных поперечных сечений падающего света и акустической волны имеет вид:¹

$$\xi = \frac{\alpha^2}{8} \cdot \frac{L\lambda}{H^2} \approx \frac{\alpha^2}{8} \cdot \frac{1}{(f \cdot \tau)} \cdot \left(\frac{L}{H}\right)^2, \quad (2)$$

где f - частота звука, соответствующая длине волны λ , τ - время задержки звука на апертуре света L .

Из (2) видно, что с ростом α , понижением частоты f , уменьшением τ или ростом $(\frac{L}{H})$ величина ξ может оказаться настолько большой, что спектральное разрешение АО спектроанализатора ухудшится в $(1 + \xi)$ раз вследствие уширения низкочастотного крыла дифракционного пятна (см. рис. 2, слева вверху). Например, при

¹ Формула справедлива для звука, распространяющегося вдоль самого медленного направления, однако ее несложно получить и для произвольного случая.

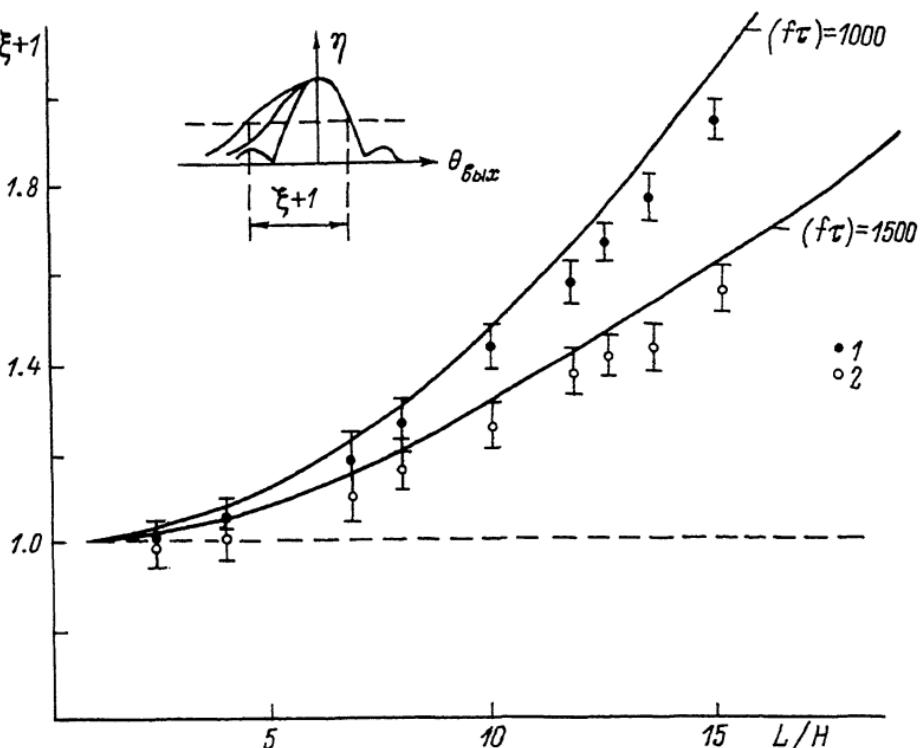


Рис. 2. Зависимость величины относительного спектрального разрешения анизотропной АО ячейки из $TelO_2$ от отношения ширины L к высоте H падающего светового луча. η - дифракционная эффективность, $\theta_{вых}$ - угол дифракции света, штриховая линия - расчет по формуле (2); экспериментальные результаты: 1 - $H = 1.0$ мм, $(f \cdot \tau) = 1000$; 2 - $H = 1.5$ мм, $(f \cdot \tau) = 1500$.

создании АО спектроанализатора с разрешением 120 кГц на основе медленной сдвиговой волны в $TelO_2$, с центральной частотой $f = 40$ МГц при $L = 8$ мм и $H = 1$ мм, согласно (2), получаем $\xi = 0.54$, что означает ухудшение спектрального разрешения вследствие анизотропного эффекта в 1.54 раза.

Экспериментальные наблюдения рассматриваемого эффекта проводились с использованием АО ячейки из $TelO_2$ размерами $10 \times 15 \times 20$ мм³. Преобразователь из $LiNbO_3$ $\text{Y}Z + 163^\circ$ - среза присоединялся к звукопроводу с помощью вакуумной металлической сварки. Дифракция света осуществлялась на медленной сдвиговой волне, возбуждаемой в направлении [110] с поляризацией вдоль [110]. Акустооптическая ячейка работала в полосе частот 50-80 МГц. На рис. 2 представлены экспериментальные зависимости величины спектрального разрешения от отношения апертур световой и звуковой волн ($\frac{L}{H}$) для фиксированных значений произведения центральной частоты звука на время задержки $(f \cdot \tau)$. Как видно из рисунка, для АО спектроанализатора с заданным произведением

$(f \cdot \tau)$ существует максимальное значение $(\frac{L}{H})$, выше которого спектральное разрешение заметно ухудшается вследствие упомянутого выше эффекта акустической анизотропии.

Заметим, что в случаях распространения звука под углом к самому медленному направлению описанное анизотропное уширение дифракционных состояний будет происходить как на левом, так и на правом крыльях углового распределения, а формула (2) будет иметь несколько иной вид.

Таким образом, в работе впервые установлено, что в сильно акустически анизотропных материалах при определенных условиях происходит заметное уширение дифракционных состояний, что может оказаться на спектральном расширении акустооптических устройств. Найдем критерий ($\zeta < 1$), обеспечивающий выбор условий АО взаимодействия, снижающих влияние указанного эффекта.

Л и т е р а т у р а

- [1] Антонов С.Н., Кузнецова Е.В., Миргородский В.И., Проклов В.В. - Ак. ж., 1982, т. 28, № 4, с. 433.
- [2] Антонов С.Н., Герус А.В., Проклов В.В. - ЖТФ, 1983, т. 53, № 8, с. 1618.
- [3] Yano T., Watanabe A. - Appl. Phys. Lett., 1974, v. 24, N 6, p. 256.

Институт радиотехники
и электроники АН СССР,
Москва

Поступило в Редакцию
25 июля 1988 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 21 12 ноября 1988 г.

ПРЯМОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РОСТА ОПТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ „СПРЯТАННОГО” КОЛЛЕКТИВНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ 1.7 эВ π -ЭЛЕКТРОНОВ БЕНЗОЛЬНОГО КОЛЬЦА

Л.В. Иогансен, Ф.А. Уваров

Вопрос о природе и спектре возбуждений π -электронных колец и цепочек весьма актуален, в частности, потому, что последние возникают на реконструированной поверхности кремния [1]. Природа наблюдаемого на Si (III) (2 x 1) π -электронного возбуждения 0.58 эВ дискутируется [2]. По нашим представлениям [3, 4], это возбуждение в первом приближении полностью подобно давно предсказанному нами „спрятанному” π -электронному возбуждению 1.7 эВ бензольного кольца. Последнее мы наблюдали в [5]